METHOD OF FORMING MICROLENS

Patent number:

JP3173472

Publication date:

1991-07-26

Inventor:

KAWASHIMA HIKARI; KUNOSATO

YUUICHI

Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Classification:

- international:

H01L27/14; H04N5/335; H01L27/14;

H04N5/335; (IPC1-7): H01L27/14;

H04N5/335

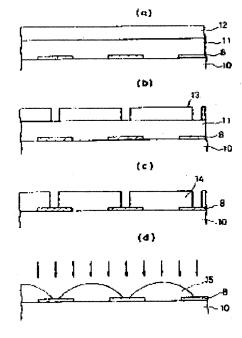
- european:

Application number: JP19890313759 19891201 Priority number(s): JP19890313759 19891201

Report a data error here

Abstract of JP3173472

PURPOSE:To realize high light converging capability which is thermally stable, by a method wherein, after the unnecessary part of photosetting type resin layer formed on a semiconductor substrate is eleminated before photo-setting, and thermal flow is performed, the resin layer is subjected to photo-setting. CONSTITUTION: A photo-setting type transparent resin layer 11 is formed on a semiconductor substrate on which a photodetecting part and a transferring part are formed. A photoresist layer 12 is formed on the layer 11. By exposing and developing the layer 12, the unnecessary part on a light shielding film 8 is eliminated, and a photoresist pattern 13 is formed. By using the pattern 13 as a mask, the unnecessary part of the layer 11 is etched and eliminated, and a transparent resin pattern 14 is formed. Since the pattern 14 is not subjected to photo-setting, thermal flow is caused by high temperature baking, and the section is turned into a hemispherical type. By exposing the whole surface, at a time photo-setting is progressed, and microlenses 15 are formed.





⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

[®] 公開特許公報(A) 平3-173472

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)7月26日

H 01 L 27/14 H 04 N 5/335

V 8838-5C 8122-5F

F H 01 L 27/14

D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

ᡚ発明の名称 マイクロレンズの形成方法

②特 頭 平1-313759

②出 願 平1(1989)12月1日

⑩発明者 川島

光 兵庫県伊

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社エル・

エス・アイ研究所内

@発明者 九ノ里 勇一

兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社エル・

エス・アイ研究所内

⑩出 顯 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

四代理 人 弁理士 大岩 増雄

外2名

3EST AVAILABLE COPY

明 細 書

1. 発明の名称

マイクロレンズの形成方法

2. 特許請求の範囲

受光部および信号転送部を有する半導体基板上に光硬化型の透光性樹脂層を形成し前記透光性樹脂層の各受光部間の一部を除去して透光性樹脂パターン層を形成する工程と、前記透光性樹脂パターン層を熱フローさせる工程と、前記熱フローさせた透光性樹脂パターン層を光硬化させる工程とを有することを特徴としたマイクロレンメの形成方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は光電変換部の前方に配設されて用い られるマイクロレンズの形成方法に関するもので ある。

〔 従来の技術 〕

第2図は例えば特公昭60-59752号公報に 開示されている固体機像業子の構成を示す断面図 である。同図において、1はシリコン基板、2はフォトダイオード、3はチャネルストッパ、4は転送部、5は絶録層、8はポリシリコンゲート、7は絶録層、8はアルミニウム速光膜、9はマイクロレンズ、10は固体操像素子の下地部としての半導体基板である。

このように構成される固体操像素子のマイクロレンズ 9 は、次のようにして形成される。すなわち、第 3 図(a) に示すように受光部かよび転送ない 5 本有する半導体基板 1 0 上に熟軟化性を有する光度 8 を形式により避光膜 8 を形式により避光度 8 を形成の 2 が 2 が 2 を形成させて同図(c) に示すようなマイクロレンス 9 を形成させて同図(c) に示すようなマイクロレンス 9 を形成させる。

とのような方法で形成されたマイクロレンズ 8 は、高い曲率を容易に得ることができ、高い集光 能力が得られる。

BEST AVAILABLE COPY

持開平3~173472 (2)

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、前述したマイクロレンズ 8 は、 熱軟化性の透光性材料からなる透光膜パターン8b を加熱するととによつて形成させているので、熱 安定性に欠けるなどの問題があつた。

[課題を解決するための手段]

このような課題を解決するためにこの発明は、 受光部および信号転送部を有する半導体基板上に 光硬化型の透光性樹脂層を形成し、各受光部間の 一部を除去して透光性樹脂パターン層を形成した 後、熱フローを行ない、しかる後にこの透光性樹脂パターン層を光硬化させるものである。

(作用)

この発明におけるマイクロレンメの形成方法に おいては、熱フローさせた後に光硬化させるので、 熱安定性が高くなる。

〔寒笳例〕

以下、この発明の一実施例を図について説明する。

第1図4)~(d)はこの発明によるマイクロレンズ

グ(例えば0:プラズマエッテング等)により除去し、しかる後、フォトレジストパターン13を 制離材(例えばアルコール,アセトン等)により除去して阿図(c)に示すように光硬化型の透光性樹脂パターン14を形成する。次にとの透光性樹脂パターン14は光硬化していないので、高温度でベークするととによつて熱フローし、阿図(d)に示すように断面が半球状に形成され、引き続き全面を一括第光するととによつて光硬化し、マイクロレンズ15が形成されるととになる。

なか、前述した実施例にかいては、マイクロレンズ15の母材としての光硬化型透光性樹脂層11をエンチングさせるフォトレジストパターン13は一層の場合について説明したが、層間にパッファ層等を介在させた多層レジストパターンを用いてもない。

[発明の効果]

以上説明したようにとの発明によれば、光硬化型の透光性樹脂層を光硬化せずに不要部分を除去し、熱フローさせた後に光硬化させたことにより、

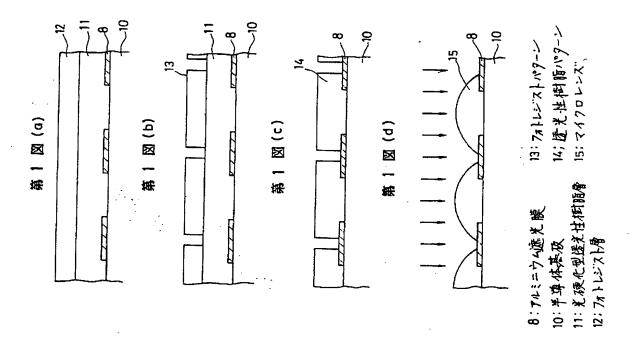
の形成方法の一実施例を説明するための工程の断 面図であり、前述の図と同一部分には同一符号を 付してある。 同図において、まず同図(4)に示すよ うに受光部および転送部などが形成された半導体 差板10上に光硬化型の透光性樹脂(例えば(株) 富士楽品製FVR, (株)日本合成ゴム製MES等) による光硬化型の透光性樹脂層 1 1 をヌピン盆布 法等により形成した後、引き続きポジ型フォトレ ジスト(例えば(株)東京応化製 OFPR-800 . ODUR-10B 等)もしくは下層の光硬化型の透 光性樹脂層!1を光硬化させない程度の光吸収性 を有するかもしくは感光故長の異なるネガ型フォ トレジスト (例えば (株) 日立化成製 B D - 2000 N. (株) 東京応化製 OMR-85等) によるフォ トレジスト層12をスピン盤布法等により形成す る。次に同図6)に示すようにフォトレジスト層 12 を露光現像し、遮光膜8上の不要部分を除去して フオトレジストパターン13を形成する。次にと のフォトレジストパターン13をマスクにして光 硬化型の透光性樹脂層11を不要部分をエッチン

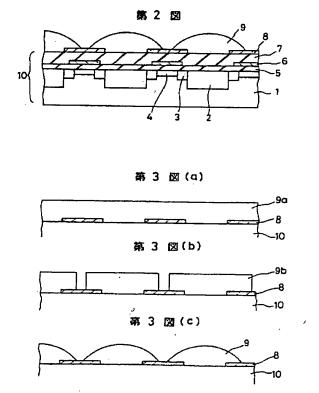
熱的に安定でかつ高い集光能力を有するマイクロ レンズが得られるという復めて使れた効果が得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例によるマイクロレンズの形成方法を示す工程の断面図、第2図は従来のマイクロレンズを用いた固体操像素子の構成を示す断面図、第3図は従来のマイクロレンズの形成方法を示す工程の断面図である。

代理人 大岩蜡堆





TING PAGE LEFT BLANK